

RP



RP

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) został udzielony na rzecz:

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska

PATENT

NR 235566

NA WYNALAZEK PT.

Przyrząd pomiarowy do mikroskopowej obserwacji i pomiaru deformacji materiałów w czasie rzeczywistym

*przedstawiony w opisie patentowym
włączonym do niniejszego dokumentu*

Patent trwa od dnia: **2018-02-27**

Warszawa, dnia 2020-10-06

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Patentowego

Bąkowska
Agnieszka Bąkowska
PODREFERENDARZ

RP

RP